Zusammenfassung Stochastik 3

Modell. Gegeben sei ein Parametrisches Modell, d. h.eine Zufallsgröße X, deren Verteilungsfunktion $P_X \in \{P_\vartheta \mid \vartheta \in \Theta \subset \mathbb{R}^n\}$ von einem Parameter ϑ abhängt.

Problem. Anhand einer **Stichprobe** $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}^1$ von X (d. h. $x_1, \ldots, x_n$ sind Realisierung von iid ZGen $X_1, \ldots, X_n \sim P_X$) ist zu entscheiden, ob die sogenannte **Nullhypothese** $H_0 : \vartheta \in \Theta_0 \subset \Theta$ oder eine **Gegenhypothese** $H_1 : \vartheta \in \Theta_1 = \Theta \setminus \Theta_0$ angenommen oder abgelehnt werden soll.

Def. Der **Stichprobenraum** ist $(\mathbb{R}^n, \mathfrak{B}(\mathbb{R}^n), P_\vartheta \times \ldots \times P_\vartheta)$

Terminologie. Die Hypothese H_i heißt **einfach**, falls $|H_i| = 1$, andernfalls **zusammengesetzt**.

Def. Ein (nichtrandomisierter) **Test** für H_0 gegen H_1 ist eine Entscheidungsregel über die Annahme von H_0 basierend auf einer Stichprobe, die durch eine messbare Abbildung $\varphi : \mathbb{R}^n \to \{0, 1\}$ augedrückt wird und zwar durch

$$\varphi(x_1, \ldots, x_n) = \begin{cases} 0 & \text{bei Annahme von } H_0, \\ 1 & \text{bei Ablehung von } H_0. \end{cases}$$

Def. Der **Ablehungsbereich** oder **kritische Bereich** von φ ist

$$K_n \coloneqq \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \varphi(x_1, \ldots, x_n) = 1\}.$$

Bem. Es gilt $\varphi = \mathbb{1}_{K_n}$.

Def. Ein **Fehler 1. Art** ist eine Ablehnung der Nullhypothese H_0, obwohl H_0 richtig ist; ein **Fehler 2. Art** ist eine Annahme von H_0, obwohl H_0 falsch ist.

Def. Die **Güte- oder Machtfunktion** des Tests φ ist

$$\begin{aligned} m_\varphi : \Theta \to [0, 1], m_\varphi(\vartheta) &\coloneqq \mathbb{E}_\vartheta \varphi(X_1, \ldots, X_n) \\ &= \mathbb{P}_\vartheta((X_1, \ldots, X_n) \in K_n) \\ &= (P_\vartheta \times \ldots \times P_\vartheta)(K_n) \end{aligned}$$

Die Gegenwsk. $(1 - m_\varphi(\vartheta))$ heißt **Operationscharakteristik** von φ.

Bem. Es gilt

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_\vartheta(\text{Fehler 1. Art}) &= m_\varphi(\vartheta) && \text{für } \vartheta \in \Theta_0, \\ \mathbb{P}_\vartheta(\text{Fehler 2. Art}) &= 1 - m_\varphi(\vartheta) && \text{für } \vartheta \in \Theta_1. \end{aligned}$$

Def. Ein Test $\varphi : \mathbb{R}^n \to \{0, 1\}$ mit

$$\sup_{\vartheta \in \Theta_0} m_\varphi(\vartheta) \leq \alpha$$

heißt **α-Test** o. **Signifikanztest** zum **Signifikanzniveau** $\alpha \in (0, 1)$.
Ein α-Test φ heißt **unverfälscht** (erwartungstreu, unbiased), falls

$$\inf_{\vartheta \in \Theta_1} m_\varphi(\vartheta) \geq \alpha.$$

Situation. Sei nun eine Stichprobenfunktion oder **Teststatistik** $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^1$ gegeben. Wir wollen einen Test der einfachen Nullhypothese $H_0 : \vartheta \in \Theta_0 = \{\vartheta_0\}$ entwickeln.

Def. $K_n^T \subset \mathbb{R}^1$ heißt **kritischer Bereich der Teststatistik**, falls

$$K_n = T^{-1}(K_n^T).$$

Bem. Es gilt

$$\begin{aligned} m_\varphi(\vartheta_0) &= \mathbb{P}_{\vartheta_0}((X_1, \ldots, X_n) \in K_n) = \\ &= \mathbb{P}_{\vartheta_0}((T(X_1), \ldots, T(X_n)) \in K_n^T) = \int_{K_n^T} f_T(x) \, \mathrm{d}x \leq \alpha, \end{aligned}$$

wobei f_T die Dichte von $T(X_1, \ldots, X_n)$ unter H_0 ist.

Bsp. Sei $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, σ bekannt und $\alpha \in (0, 1)$ vorgegeben.
Zum Test der Nullhypothese $H_0 : \mu = \mu_0$ wählen wir als Statistik

$$T(X_1, \ldots, X_n) \coloneqq \tfrac{\sqrt{n}}{\sigma}(\overline{X_n} - \mu_0) \quad \text{mit } \overline{X_n} \coloneqq \tfrac{1}{n}(X_1 + \ldots + X_n).$$

Unter Annahme von H_0 gilt $T(X_1, \ldots, X_n) \sim \mathcal{N}(0, 1)$.
Der Ablehnungsbereich der Statistik ist

$$K_n^T = \{t \in \mathbb{R}^1 \mid |t| > z_{1-\alpha/2}\} \quad \text{mit} \quad z_{1-\alpha/2} \coloneqq \Phi^{-1}(1 - \alpha/2).$$

Für $\alpha = 0,5$ gilt beispielsweise $z_{1-\alpha/2} \approx 1,96$.